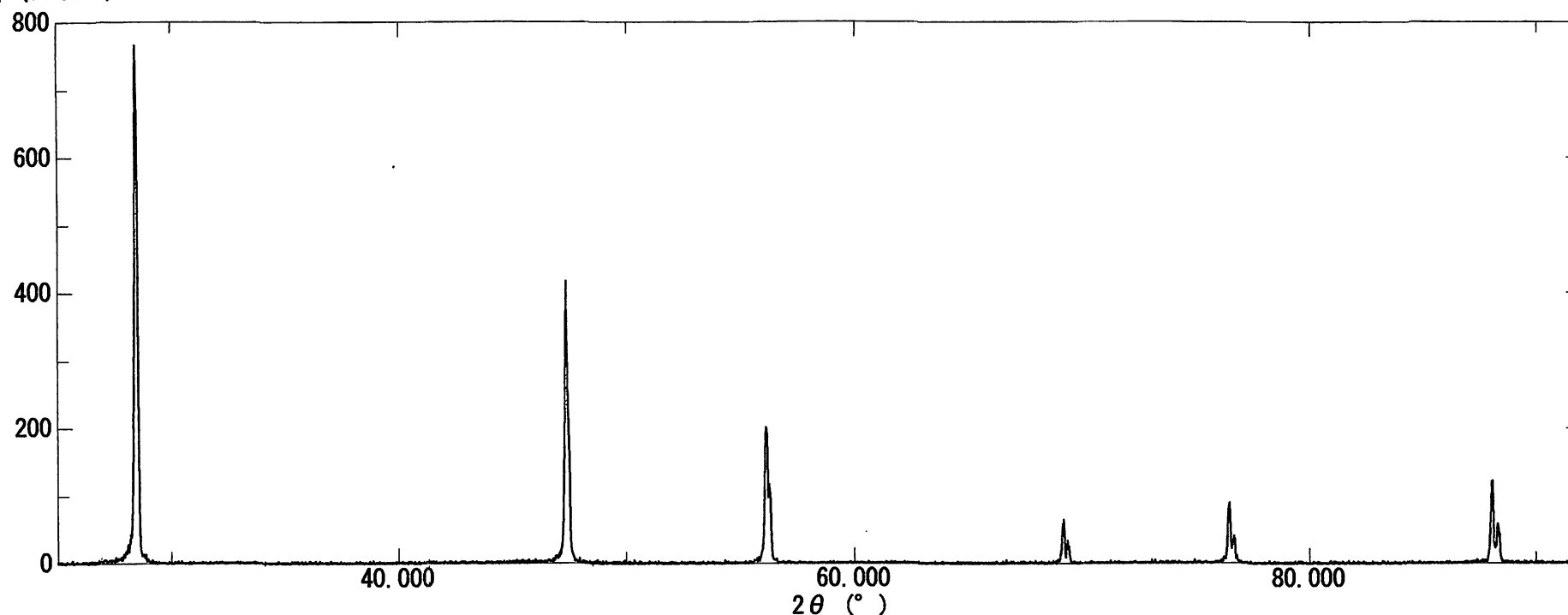


生データ

サンプル名	: シリコン粉末	ファイル	: test_1.raw	コメント	: 実験第二
測定者	: Administrator	測定日	: 24-August-20 17:20:49		
メモ					
X線	: Cu / 30 kV / 15 mA				
ゴニオメータ	: MiniFlex II ゴニオメータ +				
アタッチメント	: 標準試料ホルダ				
試料番号	: 1				
フィルタ	: K β フィルタ	発散スリット	: 1.25°		
インシデントモノクロ	: 不使用	散乱スリット	: 1.25°		
カウンタモノクロメータ	: 固定モノクロメータ	受光スリット	: 0.3mm		
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (MiniFlex II)	モノクロ受光スリット	: 0.8mm		
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 8.000 °/min.	サンプルリニア幅	: 0.020 °
走査軸	: 2 θ / θ	走査範囲	: 25.000 ~ 92.000 °	θ オフセット	: 0 °
積算回数	: 1				

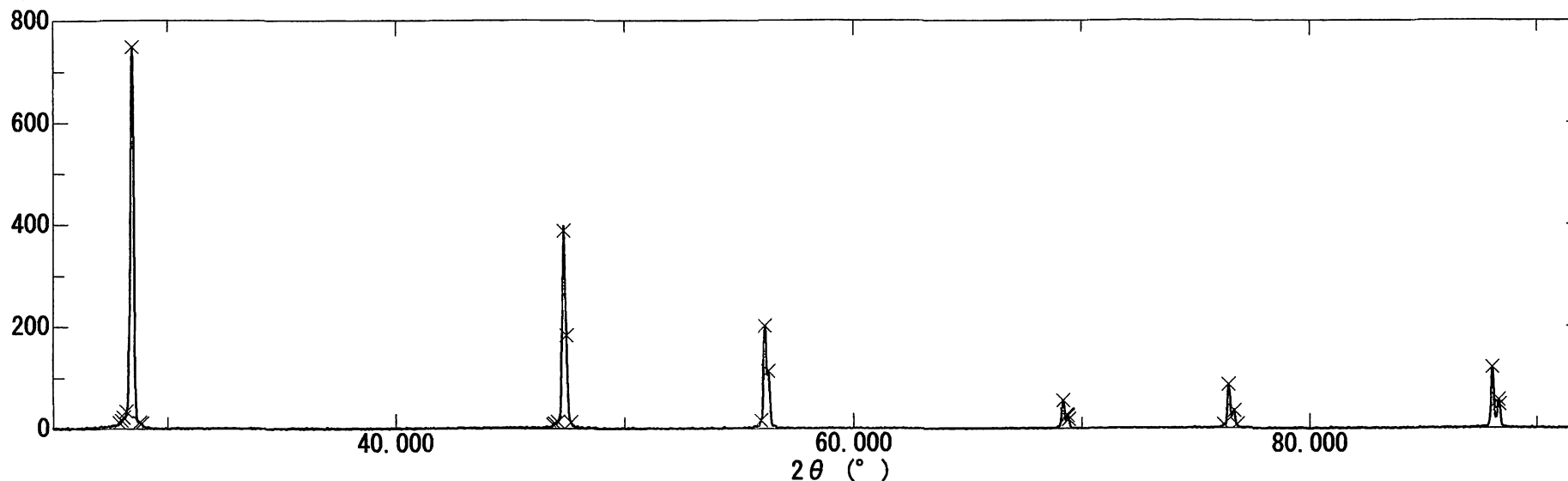
強度 (counts)



ピークサーチ

サンプル名 : シリコン粉末 ファイル : test_1.raw 測定日 : 24-August-20 17:20:49 測定者 : Administrator
 コメント : 実験第二 元 :
 方法 : 二次微分法 ピーク幅しきい値 : 0.080 ° ピーク強度しきい値 : 7.91 counts

強度 (counts)



ピーク番号	2 θ	ピークサーチ設定幅	d 値	強度	相対強度	ピーク番号	2 θ	ピークサーチ設定幅	d 値	強度	相対強度
1	27.900	0.047	3.1952	12	2	16	56.300	0.118	1.6327	112	15
2	28.000	0.047	3.1840	16	3	17	69.160	0.118	1.3572	56	8
3	28.080	0.094	3.1751	23	4	18	69.320	0.047	1.3544	28	4
4	28.200	0.047	3.1619	35	5	19	69.360	0.047	1.3538	26	4
5	28.460	0.141	3.1336	749	100	20	69.400	0.047	1.3531	19	3
6	28.780	0.047	3.0995	13	2	21	76.180	0.071	1.2486	8	2
7	28.860	0.094	3.0911	11	2	22	76.400	0.141	1.2456	87	12
8	46.860	0.047	1.9372	9	2	23	76.640	0.071	1.2423	35	5
9	46.920	0.047	1.9349	11	2	24	76.760	0.047	1.2406	9	2
10	47.060	0.047	1.9294	14	2	25	88.060	0.118	1.1083	120	17
11	47.320	0.094	1.9194	387	52	26	88.320	0.071	1.1057	57	8
12	47.480	0.047	1.9133	183	25	27	88.360	0.094	1.1053	48	7
13	47.660	0.047	1.9065	13	2						
14	55.960	0.047	1.6418	16	3						
15	56.140	0.118	1.6370	201	27						